

Международные стандартные подпружиненные испытательные щупы для внутритрубного испытания

Во время внутрисхемных испытаний (ИКТ) измеряются все компоненты на печатной плате. Также обнаруживаются дефектные компоненты и их можно соответствующим образом заменить.

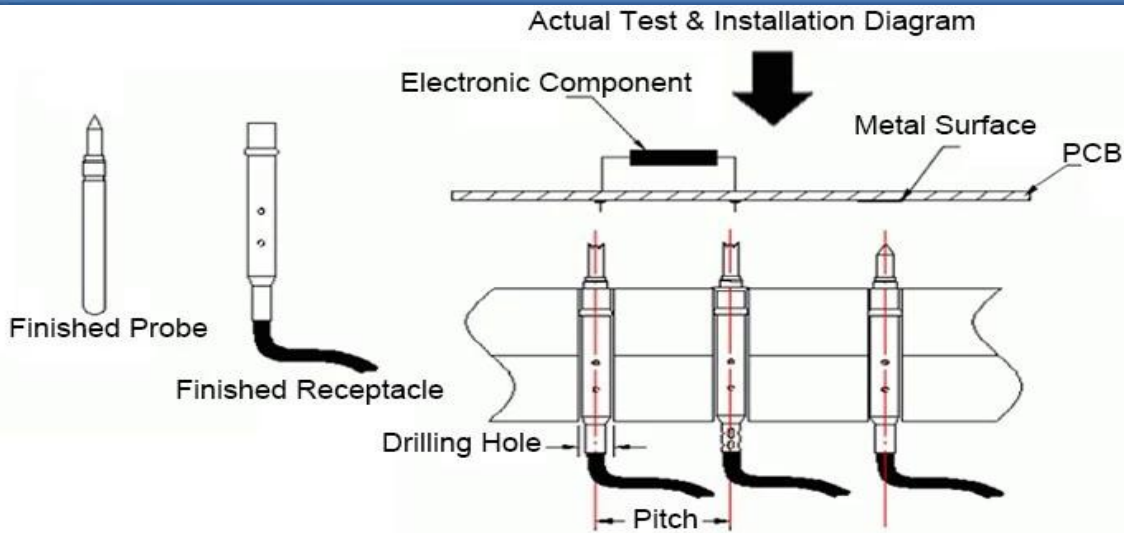
Product Information

SFENG

Штыревой контактный пробник используется для проверки электрических характеристик, если внутрисхемные компоненты на печатной плате и соединение между сетевыми сетями. Оно может измерять компоненты, такие как резисторы, конденсаторы, индукторы и выполнять функциональные испытания оптопары, трансформаторы, операционные усилители, модули питания и интегральные схемы.

Installation of probe pin

SFENG



ICT Test Probe Catalogue

SFENG

Штырь для пробного штыря SF-P11

SFENG
The China's The World's



Штырь для пробного зонда серии SF-P111



Штыревой пробник пробника SF-P100



Comapany Introduction

SFENG

Suzhou Shengteng Electronic Co., Ltd является ведущим производителем контрольного пробного штыря в Китае. В 1984 году мы создали первую фабрику в городе Цыси, мы специализируемся на штыревых выводах, контрольных зондах Bare PCB, испытательных пробниках в цепи, высоких тока щупы и полупроводниковые щупы для более 30years. With преимущества современного оборудования и строгого процесса проверки, наши продукты хорошо видеть в Европе, Северной Америке и Юго-Восточный Asia. In будущего, мы будем продолжать упорно работать с мечтой Китая и мира.
Ждем сотрудничества с вами.

Factory Show

SFENG

